

2009年9月15日

報道関係者各位

No.57120

株式会社 東陽テクニカ

SSD、組込製品内蔵NANDフラッシュの信頼性評価、試験を容易に実現
NANDフラッシュサイクルテスタ"NCT-100"型販売開始

株式会社東陽テクニカ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：渡辺洋介、以下東陽テクニカ）はこのたび、NANDフラッシュサイクルテスタ"NCT-100"型（東陽テクニカ製）の販売を開始しました。



NCT-100本体

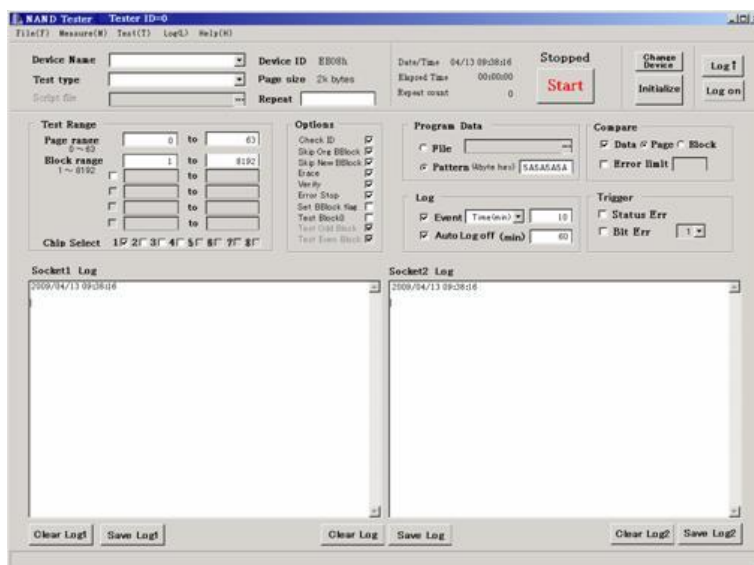


NANDフラッシュアダプタ

"NCT-100"型は、NANDフラッシュメモリ単体に対して各種コマンド実行、レスポンスタイム測定、耐久試験、不良箇所分析を実現する小型ファンクションテスタです。メモリへのイレーズ、書込み、リード等のコマンドは、デバイスに応じ最適化し、ほぼメモリ性能と同等の速度で実行されます。SSD製品、NANDフラッシュ組み込み製品、NAND/SSD/SD/MMC用コントローラ、その他NANDフラッシュ応用製品開発の際や以下の用途で効果を発揮します。

- ・デバイス採用時、特性/信頼性/耐久性の評価ツールとして
- ・エラービットリアルタイム検出、外部トリガ機能にてECCエラー訂正性能の検証
- ・レスポンスタイム測定による性能測定、劣化傾向の測定
- ・先天、後発バッドブロックを短時間で判定

従来、単体NANDフラッシュメモリの耐久試験やレスポンスタイム測定は、高価な半導体メーカー向けメモリテスタで行われていました。また、NANDデバイス機能試験と温度環境試験の併用については、有効なテスタがありませんでした。東陽テクニカでは、従来から培ってきたSCSI、ATA /ATAPI アナライザおよびテスター技術をベースに低価格でベンチや恒温槽での使用が可能なNANDフラッシュメモリ用信頼性および解析用サイクルテスタを提供いたします。



■標準搭載テスト機能

- ・ バッドブロックスキャン(全ブロック)
 - ・ 書込み/ベリファイ サイクルテスト
 - ・ 読み出し/ベリファイ サイクルテスト
 - ・ リードディスターブ サイクルテスト
 - ・ リードタイム スキャン
 - ・ プログラムタイム スキャン
 - ・ イレーズタイム スキャン
 - ・ レスポンスタイム スキャン
 - ・ メモリデータ内容ダンプ
 - ・ データのセーブ
- * カスタムスクリプトの定義にて任意のテスト手順を実行可能(オプション)

■ 価格： NCT-100型： ¥1,650,000- (税別)

■ 売上計画： 初年度100台

■ Webサイト： <http://www.toyo.co.jp/sdp>

NCT-100型に関するご質問は下記までお願いいたします。

株式会社東陽テクニカ 汎用計測営業部 加倉井

Tel:03-3279-0771 fax:03-3245-0645 e-mail:sdp@toyo.co.jp

その他当社に関するご質問は下記までお願いいたします。

株式会社東陽テクニカ 経営企画室

Tel:03-3279-0771 fax:03-3245-0645 e-mail:kikaku@toyo.co.jp